

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 0 944 114 A2**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
22.09.1999 Patentblatt 1999/38

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **H01L 21/306**

(21) Anmeldenummer: 99104008.0

(22) Anmeldetag: 12.03.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: 18.03.1998 DE 19811878

(71) Anmelder: **SIEMENS SOLAR GmbH**  
**80807 München (DE)**

(72) Erfinder: **Holdermann, Konstantin**  
**89362 Offingen (DE)**

(74) Vertreter: **HOFFMANN - EITLE**  
**Patent- und Rechtsanwälte**  
**Arabellastrasse 4**  
**81925 München (DE)**

(54) **Verfahren zum nasschemischen pyramidalen Texturätzen von Siliziumoberflächen**

(57) Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zum naßchemischen pyramidalen Texturätzen von (100) Siliziumoberflächen. Durch die erfindungsgemäße Lösung wird eine gleichmäßige und vollkommene pyramidale Texturätzung von Siliziumoberflächen erreicht.

**:P 0 944 114 A2**

## Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum naßchemischen pyramidalen Texturätzen von Siliziumoberflächen.

[0002] Eine texturierte Oberfläche reduziert breitbandig die Reflexion des einfallenden Lichtes und erhöht damit die absorbierte Lichtintensität. Bei der Herstellung kristalliner Siliziumsolarzellen führt eine gezielte Strukturierung der Siliziumoberfläche zu einer Steigerung der Solarzellenleistung. Ein derartiges naßchemisches Strukturätzen ist jedoch nicht nur auf die Bearbeitung bzw. Herstellung von Solarzellen begrenzt, sondern ist auch für optische, für elektrochemische, für Bindetektoren bzw. - Sensoren, für Katalysatoren, für Elektroden und dergleichen geeignet.

[0003] Bekannte Verfahren zur naßchemischen pyramidalen Strukturätzung von (100)-orientierten Siliziumoberflächen verwenden basische Medien, vorwiegend mit Lösungen von Alkalihydroxiden, Alkalicarbonaten, Ammoniak bzw. Cholin. Lösungen von Hydrazin bzw. Ethylendiamin/Brenzkatechin können auch verwendet werden, sind jedoch aufgrund ihrer Toxizität von Nachteil. Die gängigsten Rezepturen bestehen aus Wasser, Natrium- bzw. Kaliumhydroxid und Alkohol. Der verwendete Alkoholanteil ist hierbei entweder Ethylenglykol oder Isopropanol. Bei den bekannten Verfahren zur naßchemischen Strukturätzung von Silizium geht es jedoch nur um die Erzeugung einer pyramidalen (tetragonalen) Textur schlechthin.

[0004] Im Hinblick auf Feinlinienmetallisierung und Anwendung von Dotierlacken oder Photoresist ist jedoch eine Textur mit kleinen Pyramiden wünschenswert.

[0005] Ein Verfahren, das auf einer Ethylenglykolhaltigen Ätzlösung basiert, ist in EP 0 477 424 A1 beschrieben. Die hier verwendete Rezeptur der Ätzlösung enthält Wasser, Kaliumhydroxid, Ethylenglykol und Silizium. Zusätzlich wird als weitere Komponente Sauerstoff zugefügt. Durch eine Sauerstoffbelüftung der Ätzlösung erhält man nach der naßchemischen Strukturätzung der Siliziumoberfläche reproduzierbar gleichmäßige Pyramiden. Die Pyramidenhöhe kann durch die Belüftungsdauer der Ätzlösung variiert werden. Längerer Sauerstoffeintrag, d.h. stärkere Oxidation des Glykols führt zu kleineren Pyramiden. Auf diese Weise können selbst fertigungstechnisch Pyramidengrößen  $\leq 2 \mu\text{m}$  hergestellt werden. Nachteilig ist hierbei jedoch, daß die auf Ethylenglykol basierende Ätzlösung nicht ad hoc verwendet werden kann, da sie eine vorhergehende Auflösung von Silizium erfordert. Untersuchungen haben gezeigt, daß sich eine anschließend mehrstündige Ruhephase als vorteilhaft für eine Ausbildung glatter (111) Flächen erweist. Eine einfache Zugabe von Silikatlösung führt nicht zum Erfolg.

[0006] Verfahren die eine auf Isopropanol basierende Ätzlösung verwenden sind beispielsweise aus US 3,998,659, aus "Uniform Pyramid Formation on Alka-

line-etched Polished Monocrystalline (100) Silicon Wafers", Bressers et al, Progress in Photovoltaics, Vol. 4, 435-438 (1996), und aus "Experimental Optimization of an Anisotropic Etching Progress for random Texturization of Silicon Solar Cells", King et al., IEEE 1991, 303-308 bekannt. Im Gegensatz zu der auf Ethylenglykol basierenden Ätzlösung kann eine auf IPA-basierende Ätzlösung sofort zur Texturätzung eingesetzt werden. Diese Ätzlösung kann mit und ohne Silikat verwendet werden. Nachteilig bei dieser Art von Lösung ist jedoch die hohe Verdampfungsrate, aufgrund eines Siedepunktes des Isopropanols von nur 82°C. Damit treten Probleme im Hinblick auf eine gleichförmige Ätzung bzw. auf eine Reproduzierbarkeit der pyramidenförmigen Oberfläche auf. Im Gegensatz zu der auf Ethylenglykol basierenden Ätzlösung neigt die auf IPA basierende Ätzlösung zu großen Pyramiden. Laut Bressers et al können durch Einsatz von Stickstoff zur Verdrängung des gelösten Sauerstoffes während des Ätzzvorganges kleine Pyramiden erzielt werden. Hierbei wird jedoch von Laborversuchen berichtet, wobei eine Ätzlösung mit 10 Vol.% Isopropanol, ein Stickstofffluß von 25 l/min und eine Prozeßtemperatur von 80°C verwendet werden. Für einen Fertigungseinsatz in Tanks ist mit einem enormen Isopropanolverbrauch zu rechnen. Dies bringt hohe Kosten mit sich, da die Lebensdauer der Ätzlösung aufgrund einer derartigen hohen Verflüchtigung des IPA gering ist. Dies führt gleichzeitig zu hohen Entsorgungskosten für die gebrauchten Chemikalien.

[0007] Für die industrielle Herstellung von Solarzellen ist die Gewährleistung einer stetig guten elektrischen Qualität der in großer Stückzahl produzierten Solarzellen wichtig. Eine gleichbleibende gute Qualität in der Ausbildung der Pyramidenstruktur, sowie eine gleichmäßige Strukturierung der gesamten Siliziumoberfläche ist zu gewährleisten. Zudem ist die Möglichkeit die Pyramidengröße in einem gewissen Bereich variieren zu können von Vorteil.

[0008] Weder die auf Ethylenglykol basierende Ätzlösung, noch die auf Isopropanol basierende Lösung sind jedoch in der Lage, diese Anforderungen gleichzeitig zufriedenstellend zu erfüllen. Wie oben zusammengefaßt ist zwar die mit Ethylenglykol versetzte wässrig-alkalische Ätzlösung in der Lage Pyramiden mit einer Höhe  $\leq 2 \mu\text{m}$  herzustellen, kann jedoch nicht unmittelbar verwendet werden. Dies ist jedoch gerade für einen industriellen Einsatz von Nachteil. Andererseits kann die Isopropanol haltige Ätzlösung zwar sofort zur Texturätzung eingesetzt werden, neigt jedoch zu großen Pyramiden und erweist sich durch eine hohe Verdampfungsrate des Isopropanols als nachteilig, da dies die Reproduzierbarkeit einer gleichförmigen pyramidalen Textur beeinträchtigt.

[0009] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum naßchemischen pyramidalen Texturätzen von Siliziumoberflächen bereitzustellen, das in der Lage ist, - analog der auf Ethylenglykol

basierenden Ätzlösung - reproduzierbar kleine ( $\leq 2 \mu\text{m}$ ) Pyramidengrößen, zu erzeugen, wobei unterschiedliche Pyramidengrößen innerhalb einer gewissen Streuung einstellbar sind, bei gleichzeitig vollständiger Textur der Siliziumoberfläche und : gleichzeitiger Reduzierung der Kosten.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren nach Patentanspruch 1 gelöst.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0012] Der zentrale Gedanke der Erfindung besteht darin, daß die zum pyramidalen Strukturieren der Siliziumoberfläche verwendete Ätzlösung sowohl Isopropanol als auch wässrig-alkalische Ethylenglykollösung enthält. Die wässrig-alkalische Ethylenglykollösung wird vorteilhaft mit Sauerstoff umgesetzt, wie zum Beispiel aus EP O 477 424 A1 bekannt. Je größer die umgesetzte Sauerstoffmenge, desto kleiner kann die in der Ätzlösung verwendete Menge der Ethylenglykollösung gewählt werden. Allein durch die gleichzeitige Verwendung von Isopropanol und Ethylenglykol in der Ätzlösung wird überraschenderweise die Aufgabe gelöst und zusätzlich die folgenden Vorteile erzielt. Die Verwendung von bereits vorgeheizten und damit sauerstoffarmem Wasser wirkt sich dabei - wie auch von Bressers et al beschrieben - zu Ätzbeginn hinsichtlich kleiner Pyramiden unterstützend aus, ist aber nicht unbedingt erforderlich, da durch entsprechende Korrektur beim Glykolanteil ausgleichbar. Vorgewärmtes Isopropanol - auch bei Bressers et al beschrieben - ist aus fertigungstechnischen Gründen problematisch.

[0013] Die erfindungsgemäße Ätzlösung ist unmittelbar nach Herstellung texturfähig, d.h. ein Ätzvorgang kann unmittelbar nach dem Herstellen der Lösung durchgeführt werden.

[0014] Zudem ist das Ätzergebnis relativ unempfindlich auf die genaue Zusammensetzung der Ätzlösung, d.h. eine präzise Optimierung der einzelnen Lösungsanteile ist nicht notwendig, was insbesondere im Hinblick auf eine industrielle Anwendung von Vorteil ist.

[0015] Ein weiterer Vorteil ist die gute Reproduzierbarkeit des Ätzergebnisses. Gleichzeitig ist die Pyramidengröße einstellbar, bei gleichzeitiger vollständiger Textur der Siliziumoberfläche.

[0016] Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, daß die Ätzlösung der vorliegenden Erfindung den Nachteil einer herkömmlichen nur auf Isopropanol basierenden Ätzlösung, d.h. eine große Verdampfungsrates, in nicht so starkem Maße aufweist. Dies bedeutet, daß die erfindungsgemäße Ätzlösung wesentlich länger zum Ätzen verwendet werden kann als eine herkömmliche nur auf Isopropanol basierende Lösung. Die Ätzlösung muß folglich weniger oft ersetzt werden. Dies reduziert die Kosten, da die Ausfallzeit verringert und somit die Abfallentsorgungsmenge der verwendeten Chemikalien reduziert wird.

[0017] Im folgenden wird die Erfindung anhand einiger

Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die begleitenden Abbildungen beschrieben. Darin zeigt

Fig. 1 eine REM-Aufnahme der geätzten Oberfläche eines ersten Ausführungsbeispiels;

Fig. 2 eine REM-Aufnahme der geätzten Oberfläche eines zweiten Ausführungsbeispiels,

Fig. 3 eine REM-Aufnahme der geätzten Oberfläche eines dritten Ausführungsbeispiels, und

Fig. 4 eine REM-Aufnahme der geätzten Oberfläche eines vierten Ausführungsbeispiels.

[0018] Die erfindungsgemäße Lösung zum Ätzen eines ersten Ausführungsbeispiels setzt sich zusammen aus 15 l Wasser, 300 ml 50%-iger Natriumhydroxidlösung, 400 ml gelöstem Silikat, 600 ml Isopropanol und 15 ml wässrig-alkalischer Ethylenglykollösung. Die Temperatur der Ätzlösung wurde auf 78°C eingestellt und die Silizium-Wafer wurden für 20 Minuten in diese Lösung eingetaucht. Die hier verwendeten Siliziumscheiben weisen eine Größe von bis zu 6 Zoll auf, sind teilweise bis zu 120µm dünn geätzt und haben vor dem Ätzvorgang spiegelnde Oberflächen. Eine REM-Aufnahme der Oberfläche des mit dieser Lösung geätzten Siliziums ist in Fig. 1 dargestellt, und zeigt eine gleichmäßige und vollständige Pyramidenstruktur mit einer Pyramidenhöhe von etwa 6 µm.

[0019] In einem zweiten Ausführungsbeispiel wurde eine Ätzlösung verwendet, die aus 15 l Wasser, 600 ml 50%-iger Natriumhydroxidlösung, 300 ml Isopropanol und 30 ml wässrigalkalischer Ethylenglykollösung besteht. Silikat wurde nicht beigemischt. Diese Lösung wurde auf eine Temperatur von 78°C erwärmt, und die Silizium-Wafer wurden 10 Minuten lang in diese Lösung eingetaucht. Die Oberfläche des mit dieser Ätzlösung strukturierten Silizium-Wafers ist in Fig. 2 dargestellt. Es ist eine gleichmäßige pyramidale Siliziumoberfläche zu sehen, mit einer Pyramidenhöhe von ungefähr 3 µm.

[0020] In einem weiteren Ausführungsbeispiel wurde eine Ätzlösung verwendet, die 15 l Wasser, 50 ml 50%-ige Natriumhydroxidlösung, 100 ml Isopropanol und 50 ml wässrigalkalische Ethylenglykollösung enthält, ebenfalls ohne Zusatz von Silikat. Auch diese Lösung wurde auf eine Temperatur von 78°C erwärmt, und ein anschließender Ätzprozess wurde 5 Minuten lang durchgeführt. Die mit dieser Lösung strukturierte Siliziumoberfläche ist in der in Fig. 3 gezeigten REM-Aufnahme dargestellt. Auch hier ist eine gleichmäßige und vollständige pyramidale Struktur zu erkennen. Die Pyramiden weisen eine Höhe kleiner als 1,5 µm auf.

[0021] Weitere Siliziumproben wurde mit einer Ätzlösung geätzt, die 15 l Wasser, 400 ml 50%-ige Natriumhydroxidlösung, 400 ml Isopropanol und 25 ml wässrig-alkalische Ethylenglykollösung (ohne Zusatz von Silikat) enthält. Diese Lösung wurde auf eine Temperatur

von 60°C erhitzt und die Siliziumprobe wurde anschließend 10 Minuten in dieser Lösung geätzt. Das Ergebnis ist in Fig. 4 zu sehen. Auch hier weist die Oberfläche eine pyramidale Struktur auf, mit einer Pyramidenhöhe von ungefähr 1,5 µm.

[0022] Aus den Ausführungsbeispielen 1 bis 3 geht hervor, wie mit steigendem Glykolananteil die Pyramidengröße abnimmt. Im 4. Ausführungsbeispiel wird von einer stärker belüfteten wäßrigalkalischen Ethylenglykollösung ausgegangen, weswegen hier der Anteil verkleinert werden konnte, um wie in Beispiel 3 Pyramidengrößen von  $\leq 1,5$  µm zu erzeugen.

[0023] Jede der in den Ausführungsbeispielen verwendete Ätzlösung kann unmittelbar nach der Herstellung verwendet werden, d.h. die Ätzlösung ist unmittelbar texturfähig. Ein langwieriges Auflösen von Silizium, wie das bei bekannten auf Ethylenglykol basierenden Lösungen notwendig ist, entfällt.

[0024] Ein Zusatz von Silikat ist nicht erforderlich, wirkt sich jedoch auch nicht störend aus. Dies geht beispielsweise aus dem ersten Ausführungsbeispiel hervor, bei dem 400 ml gelöstes Silikat in der Ätzlösung enthalten ist. Auch in diesem Ausführungsbeispiel wurde eine gleichmäßige vollständige pyramidale Strukturierung erzielt.

[0025] Die vorgeschlagene Ätzlösung enthält einen nur geringen Isopropanolgehalt von vorzugsweise ca. 2 bis 5 Vol.%, um den Isopropanolverbrauch zu minimieren.

[0026] Zusätzlich geht aus den oben beschriebenen Ausführungsbeispielen hervor, daß es auf eine präzise Optimierung der einzelnen Lösungsanteile nicht ankommt, da unterschiedliche Konzentrationen unterschiedlicher Lösungsanteile eine zufriedenstellende Textur der Siliziumoberfläche ermöglichen. D.h. das Prozeßfenster der erfindungsgemäßen Ätzlösung weist eine erhebliche Größe auf, was insbesondere für einen industriellen Strukturierungsprozeß von Vorteil ist. Zudem kann, wie aus den REM-Aufnahmen der einzelnen Ausführungsbeispielen ersichtlich, die Pyramidengröße durch eine unterschiedliche Zusammensetzung der Lösung variiert werden, bei gleichbleibender zuverlässiger und vollständiger Strukturierung. Die Prozeßtemperatur wird hierbei zwischen 60°C und 80°C eingestellt, und die Ätzzeit beträgt je nach gewünschter Pyramidengröße zwischen 5 Minuten und 20 Minuten.

[0027] Weiterhin ist zu erwähnen, daß sich nativ gewachsenes Oxid, das sich bei wochenlangem Stehen der zu ätzenden Siliziumscheibe bildet, sich genauso wenig störend auswirkt, wie etwa eine unterschiedliche Siliziumoberflächenbeschaffenheit (z.B. rauh oder poliert).

[0028] Um einen möglichen Einfluß von nativ gewachsenem Oxid zu untersuchen, wurden Wafer, die zuvor mehrere Wochen in der Raumluft standen, trocken in die Ätzlösung eingetaucht, und Wafer, die vor dem Ätzschritt ca. 60 Minuten im WasserSpülbecken standen, wurden naß in die Ätzlösung eingetaucht. Nativ

gewachsenes Oxid ergibt in beiden Fällen keine Störung der Texturätzung. Ein vorheriger Flußsäure-Dip zur Entfernung dieses Oxids ist nicht nötig.

[0029] Ein Verbrauch der Ätzlösung kann durch Zugabe der erforderlichen Medien ausgeglichen werden, wobei diese nicht extra aufgeheizt werden müssen, um beispielsweise gelösten Sauerstoff zu minimieren.

[0030] Die erfindungsgemäße Ätzlösung eignet sich für verschiedene Formen der Medienbewegung. Möglich sind Bubbler, Rührer, Hubvorrichtungen oder ein Umpumpen der Lösung, sowie eine Kombination derartiger Vorrichtungen.

## 15 Patentansprüche

1. Verfahren zum naßchemischen pyramidalen Texturätzen von Siliziumoberflächen, dadurch gekennzeichnet, daß die Ätzlösung zum Ätzen der Siliziumoberfläche zumindest Wasser, ein basisches Reagenz und gleichzeitig Isopropanol und eine wässrig-alkalische Ethylenglykollösung enthält.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Ätzlösung Silikat beigegeben ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Ätzlösung einen Isopropanolgehalt von 0,5 bis 5 Vol.% aufweist.
4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der in der Ätzlösung enthaltene Isopropanolanteil größer als der Ethylenglykollösungsanteil ist.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von Isopropanol zu Ethylenglykollösung maximal 1:1 ist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ätzlösung eine Temperatur zwischen 60°C und 80°C hat.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Ätzzeit 5 bis 20 Minuten beträgt.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das basische Reagenz Natrium- bzw. Kaliumhydroxid ist.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daß  
die wässrig-alkalische Ethylenglykollösung mit  
Sauerstoff umgesetzt wird.

10. Ätzlösung für naßchemisches pyramidales Textur- 5  
ätzen von Siliziumoberflächen, bestehend aus  
zumindest Wasser, einem basischen Reagenz und  
gleichzeitig Isopropanol und eine wässrig-alkali-  
schen Ethylenglykollösung enthält.
11. Ätzlösung nach Anspruch 10, 10  
dadurch gekennzeichnet, daß der Ätzlösung  
Silikat beigemischt ist.
12. Ätzlösung nach Anspruch 10 oder 11, 15  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die Ätzlösung einen Isopropanolgehalt von 0,5 bis 5  
Vol. % aufweist.
13. Ätzlösung nach Anspruch 10, 11 oder 12, 20  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der in der Ätzlösung enthaltene Isopropanolanteil  
größer als der Ethylenglykolanteil ist.
14. Ätzlösung nach Anspruch 13, 25  
dadurch gekennzeichnet, daß  
das Verhältnis von Isopropanol zu Ethylenglykol  
maximal 1:1 ist.
15. Ätzlösung nach einem der Ansprüche 10 bis 14, 30  
dadurch gekennzeichnet, daß  
das basische Reagenz Natrium- bzw. Kaliumhydro-  
xid ist.
16. Ätzlösung nach einem der Ansprüche 10 bis 15, 35  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die wässrig-alkalische Ethylenglykollösung mit  
Sauerstoff umgesetzt ist.

40

45

50

55

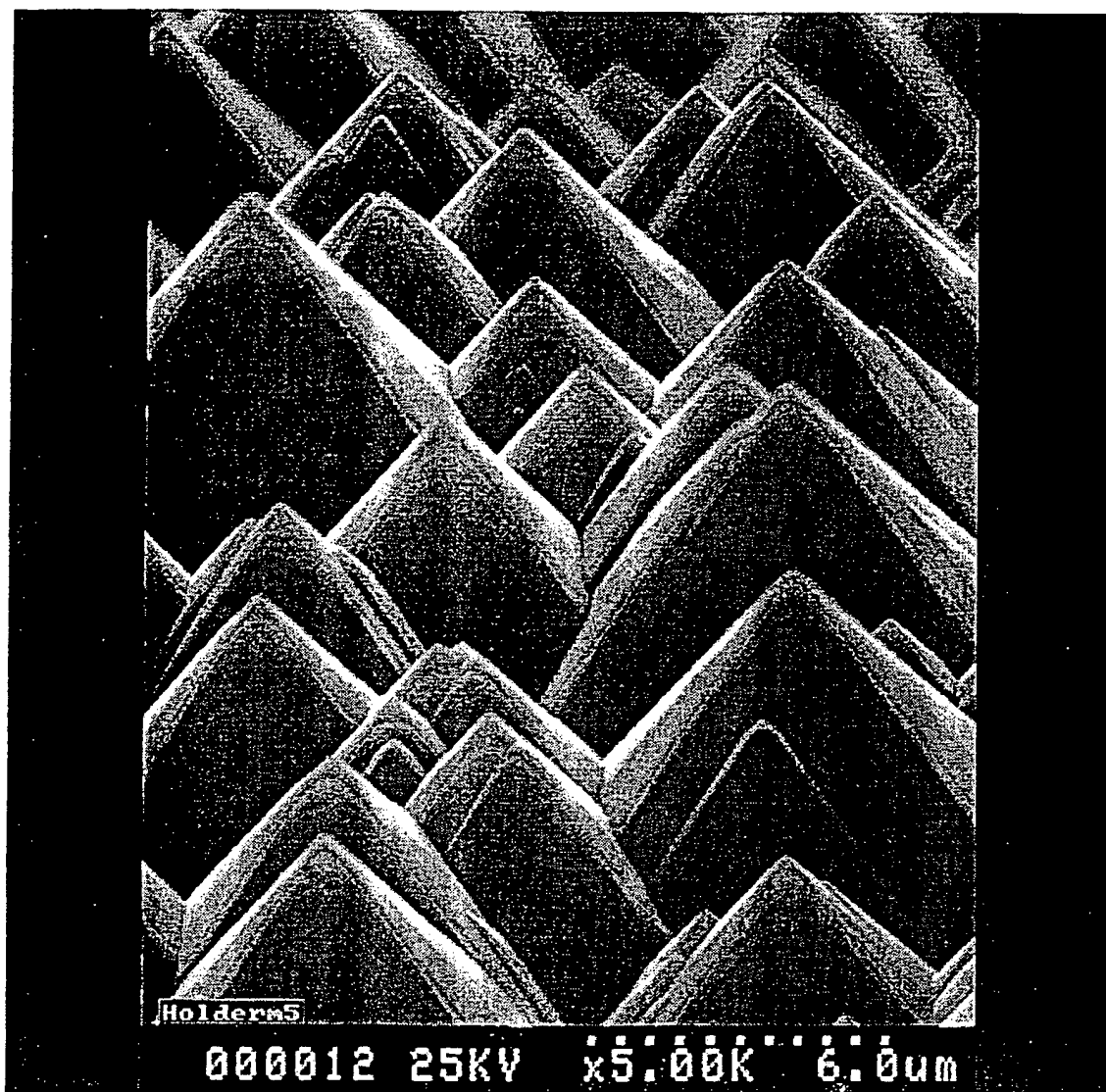


Fig. 1

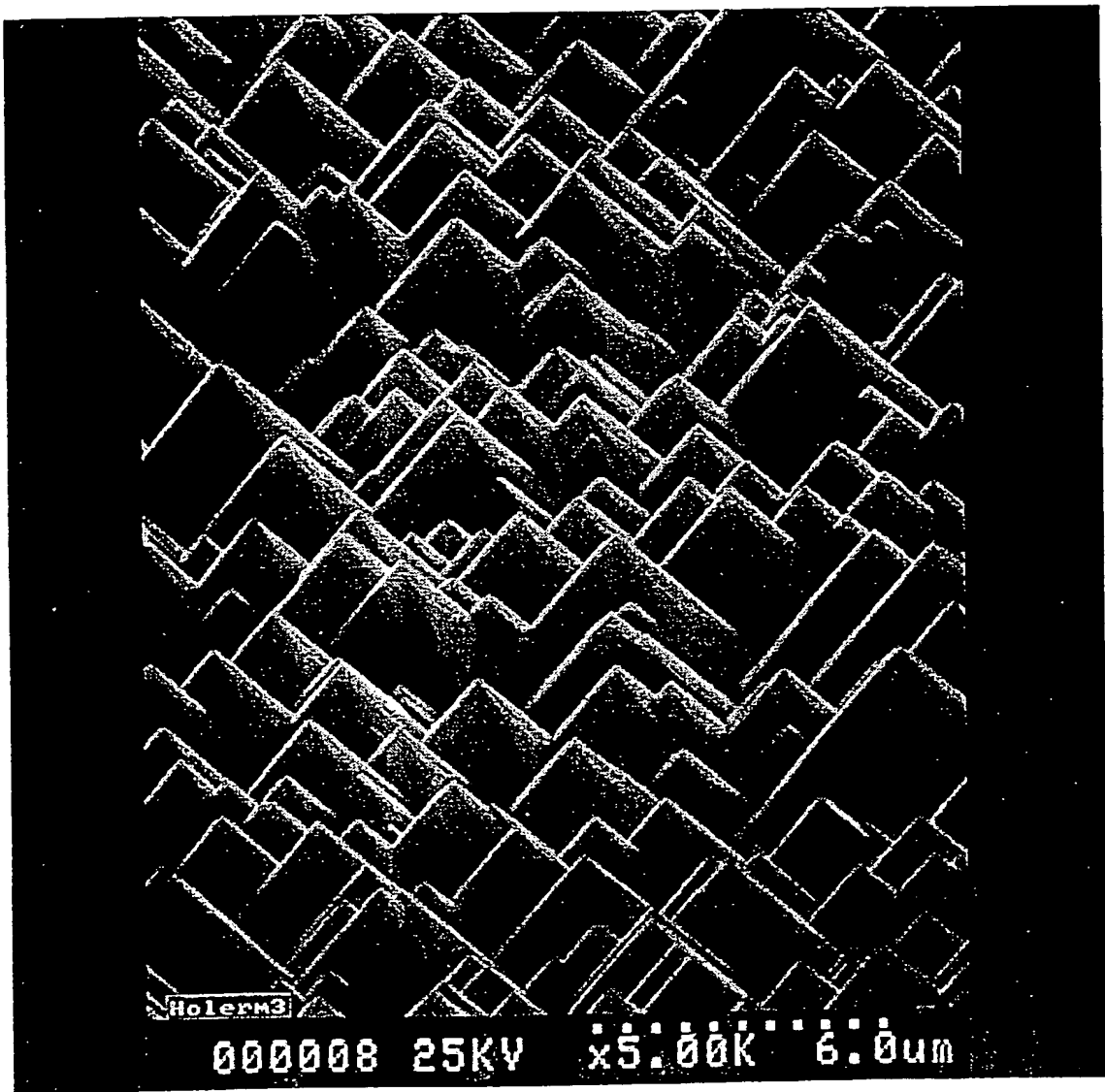


Fig. 2

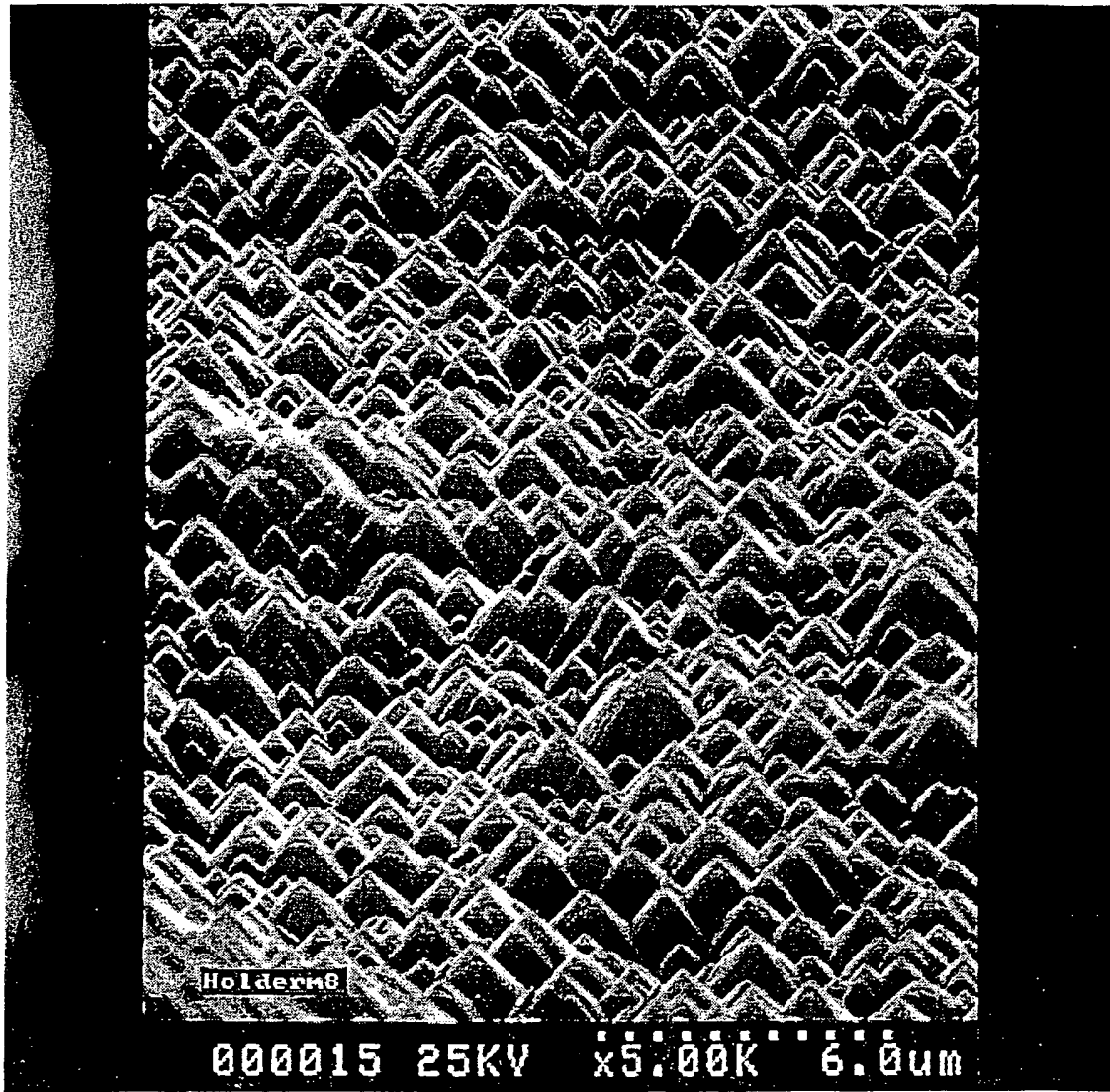


Fig. 3

BEST AVAILABLE COPY



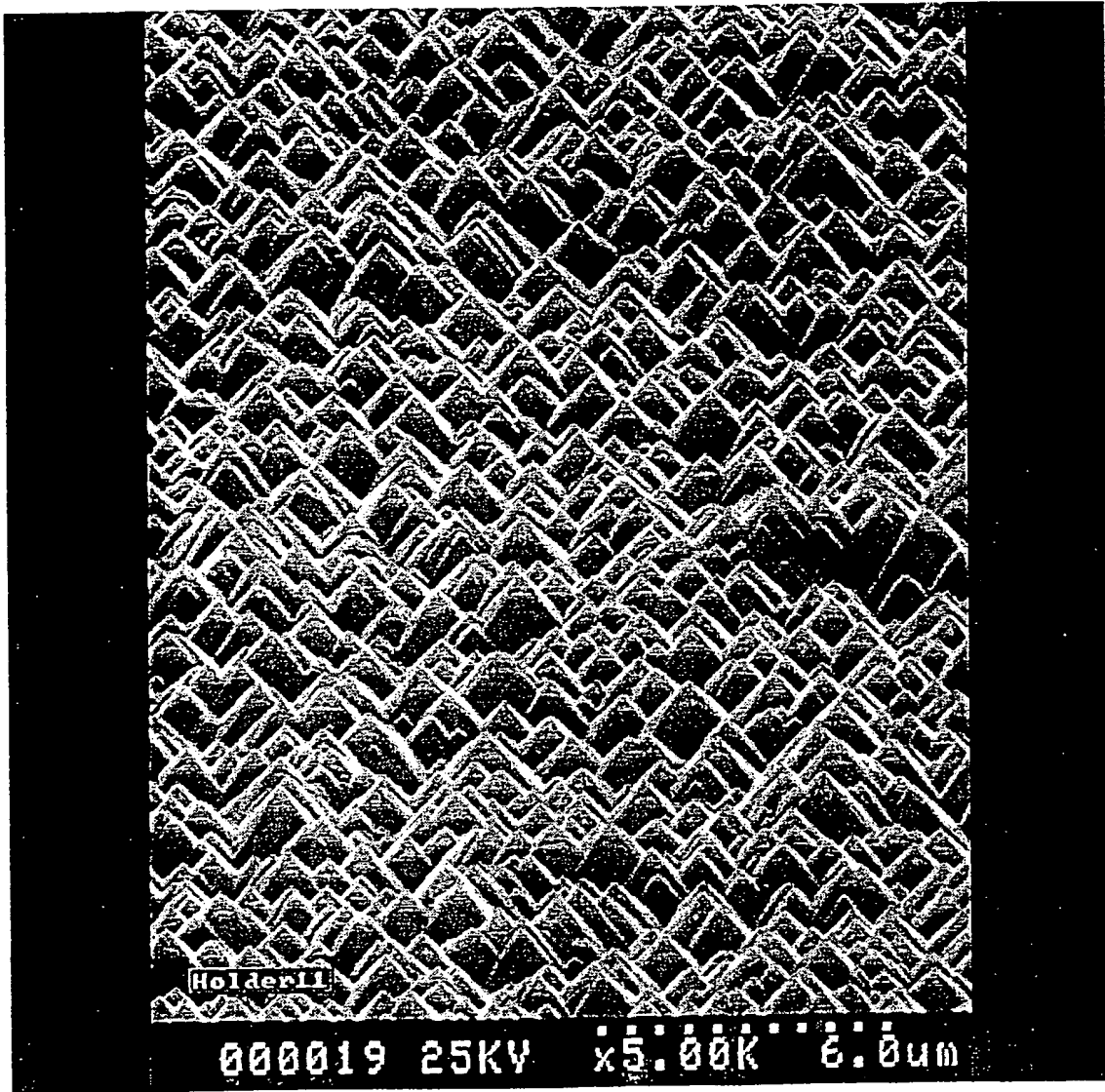


Fig. 4

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 0 944 114 A3**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:  
23.02.2000 Patentblatt 2000/08

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: **H01L 21/306**

(43) Veröffentlichungstag A2:  
22.09.1999 Patentblatt 1999/38

(21) Anmeldenummer: 99104008.0

(22) Anmeldetag: 12.03.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Erfinder: **Holdermann, Konstantin**  
**89362 Offingen (DE)**

(74) Vertreter: **HOFFMANN - EITLE**  
**Patent- und Rechtsanwälte**  
**Arabellastrasse 4**  
**81925 München (DE)**

(30) Priorität: 18.03.1998 DE 19811878

(71) Anmelder: **SIEMENS SOLAR GmbH**  
**80807 München (DE)**

(54) **Verfahren zum nasschemischen pyramidalen Texturätzen von Siliziumoberflächen**

(57) Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zum nasschemischen pyramidalen Texturätzen von (100) Siliziumoberflächen. Durch die erfindungsgemäße Lösung wird eine gleichmäßige und vollkommene pyramidale Texturätzung von Siliziumoberflächen erreicht.

**EP 0 944 114 A3**



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 99 10 4008

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.C1.6)
A	US 3 909 325 A (CHURCH CLYDE L ET AL) 30. September 1975 (1975-09-30) * Zusammenfassung *	1,3,6,8	H01L21/306
A	GB 1 250 653 A (ROGER CLYDE KRAGNESS AND HERBERT ATKIN WAGGENER) 20. Oktober 1971 (1971-10-20) * Spalte 4, Zeile 73 - Zeile 80 *	1,2,6,8, 10,11,15	
A	US 4 137 123 A (BAILEY WILLIAM L ET AL) 30. Januar 1979 (1979-01-30) * Spalte 2, Zeile 3 - Zeile 17 *		
X	US 3 940 356 A (BYRNES PETER G) 24. Februar 1976 (1976-02-24) * Spalte 2, Zeile 23 - Spalte 3, Zeile 12; Beispiele 1,4 *	10,15	
A		13	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.C1.6)
			H01L C23F
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
DEN HAAG		15. Dezember 1999	
		Prüfer	
		Szarowski, A	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet  Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie  A : technologischer Hintergrund  O : mündliche Offenbarung  P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze  E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  D : in der Anmeldung angeführtes Dokument  L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument  &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 10 4008

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15-12-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 3909325	A	30-09-1975	KEINE
GB 1250653	A	20-10-1971	BE 723234 A 01-04-1969 DE 1806225 A 28-01-1971 FR 96065 E 19-05-1972 MY 44873 A 31-12-1973 NL 6815372 A,B 05-05-1969 SE 353185 B 22-01-1973 US 3506509 A 14-04-1970
US 4137123	A	30-01-1979	KEINE
US 3940356	A	24-02-1976	CA 1049248 A 27-02-1979

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**